Anforderungskatalog zur Definition der Prozessmesstechnik und deren Schnittstellen

Benötigte Informationen:

-Definition Messbereiche, Messpräzission, Beschaffenheit der Messmatrix (ggbf. Störeffekte)

-Definition der verfahrenstechnischen Kopplung im Prozess (Verwirbelungsstrecke, Anströmung, Druck, Temperatureffekte), ggbf R&I-Schema oder CAD-Darstellung zur Einkopplung im Prozess

-Definition der Hardware- und Softwarekomponenten (Größe, Widerstand/Präzision, Signalübertragung, Kommunikationsprotokoll, T90-Zeit, Signal-Rausch-Verhältnis, Abtastdichte, ggbf. UML-Diagramm zur Software, Analog/Digital-Schnittstelle (Spannungsbereich, Widerstände etc.), Speicherdichte Microcontroller/Speicherkarte, Antennendesign ggbf. mit ANSYSHFSS, Batterielebensdauer, Auswahl und Geometrie der Materialien (Armaturen, Schutzhüllen, Verbindungen etc.), Controller/Visualisierungen, Design von Außenhülle, Design Probenahme und -entsorgung (Filter, Vorlagegefäße, Mischer etc.)

-Definition der Reinigung und Wartung

-Definition der Filterung (z.B. Grenzwertüberwachung, Medienklassifizierung etc.)

-Definition von Testständen bzw. Validierungsprozedur